

05;06

Введение феноменологического параметра релаксации напряжений, вызванных несоответствием постоянных решетки на гетерогранице

© О.В. Константинов, Е.Ю. Котельников, А.В. Матвеевцев,
А.Е. Романов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 7 марта 2001 г.

Получена аналитическая формула, описывающая увеличение ширины запрещенной зоны в квантовом кластере, который рассматривается как включение простейшей формы (сферической или плоской) при произвольной величине параметра несоответствия постоянных решеток кластера и окружающей его матрицы. Введена феноменологическая связь этого параметра с параметром релаксации напряженной границы, который рассматривается, как подгоночный. Показано, что релаксация мала или, по-видимому, вовсе отсутствует в случае квантовой ямы и проявляется в полной мере в случае квантовой точки.

Хорошо известно, что деформация полупроводника вызывает существенные изменения в его энергетическом спектре, в частности увеличение ширины его запрещенной зоны. Этот эффект определяется в основном дилатацией, т.е. изменением объема кристалла, которое обусловлено деформацией. Дилатация связана с давлением, равным одной трети шпура тензора напряжений. Зависимость ширины запрещенной зоны от давления уже давно изучалась в физике полупроводников [1]. Особую актуальность этот вопрос приобрел в теории квантовых кластеров в полупроводниках, таких как квантовые ямы и квантовые точки. Благодаря разнице постоянных решетки кластера и окружающей матрицы, давление внутри кластера может быть весьма значительным, что будет сильно влиять на спектр уровней в кластере. Вопросам расчета упругих полей напряжений в квантовых точках посвящены работы [2,3]. В этих работах, при всей изощренности расчетных методик, содержится довольно значительная неопределенность результатов. Она связана с тем, что при задании несоответствия параметров кристаллических реше-

ток на границах кластера делается предположение о том, что никакой релаксации поля напряжений на границах не происходит. Это предположение не согласуется с наблюдаемым спектром рекомбинационного излучения квантовых ям из InAs, находящихся в матрице GaAs.

В настоящей работе предложен способ введения феноменологического параметра релаксации поля напряжений на границах кластера. В совокупности с простой моделью кластера, также предлагаемой в настоящей работе, и простой теорией спектров электронных состояний, данной в нашей предыдущей работе [4], это позволит, как мы надеемся, находить величину параметра релаксации поля напряжений на границах кластеров по спектрам рекомбинационного излучения из кластеров.

Давление в кластере. Квантовые ямы, содержащие узкозонный материал, обычно имеют постоянную решетки виртуального кристалла больше, чем у окружающей матрицы. Благодаря этому материал квантовой ямы испытывает сжатие. Оно должно было бы быть особенно сильным в случае квантовой точки, зачастую состоящей из чистого узкозонного материала. При этом разность постоянных решетки кластера и матрицы Δa будет максимальной. Сжатие вызывает увеличение ширины запрещенной зоны материала кластера (квантовой ямы или квантовой точки) благодаря давлению внутри его. Согласно известным экспериментальным данным, подытоженным в монографии [1], зависимость ширины запрещенной зоны от давления для большинства полупроводников A_3B_5 является нарастающей функцией и при давлениях, меньших 20 килобар, крутизна нарастания K будет:

$$K = 12 \text{ meV/kbar}. \quad (1)$$

Если выразить давление p в гигапаскалях, то этому же соотношению можно придать вид

$$\delta E_G = 0.12 \cdot p, \text{ eV}. \quad (2)$$

Здесь δE_G — барическое увеличение ширины запрещенной зоны в электрон-вольтах. Ниже будет показано (как для сферической геометрии квантовой точки, так и для плоской геометрии квантовой ямы), что давление в обоих случаях связано одинаковым соотношением с относительной величиной параметра эффективного рассогласования постоянных решетки f :

$$p = \frac{2}{3} \frac{E}{1 - \nu} f, \quad (3)$$

где E — модуль Юнга (в гигапаскалях), ν — коэффициент Пуассона.

Подставляя (3) в (2), получим соотношение, связывающее увеличение ширины запрещенной зоны с параметром рассогласования f :

$$\delta E_G = 0.08 \frac{E}{1-\nu} f, \text{ eV}. \quad (4)$$

Введем теперь новый феноменологический параметр — параметр релаксации.

Для этого представим параметр рассогласования f в следующем виде:

$$f = \frac{\Delta a}{a} x (1 - \rho). \quad (5)$$

Здесь a — постоянная решетки матрицы, Δa — разность постоянных решеток чистого узкозонного материала и материала матрицы. Обычно широкозонная матрица имеет меньшую постоянную решетки, чем узкозонный кластер, поэтому кластер оказывается сжатым, т.е. Δa — положительная величина; x — доля чистого узкозонного материала в твердом растворе материала кластера (квантовой ямы или квантовой точки). Параметр релаксации гетерограницы кластер–матрица ρ является при нашем подходе неизвестной варьируемой величиной. Если граница напряжена и на ней отсутствуют дислокации несоответствия, то $\rho = 0$. Если же напряжений на границе нет (произошла их релаксация), то $\rho = 1$. При этом параметр рассогласования f равен нулю. Будем рассматривать для определенности кластер с составом твердого раствора $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. Тогда имеем величины $\Delta a = 4 \cdot 10^{-9}$ см, $a = 5.7 \cdot 10^{-8}$ см:

$$\frac{\Delta a}{a} = 0.07. \quad (6)$$

Таким образом, параметр рассогласования f принимает форму

$$f = 0.07 x (1 - \rho). \quad (7)$$

Для полупроводников на основе InAs мы принимаем $E = 50$ ГПа, $\nu = 1/3$ [2]. Оба последних равенства — приближенные, с точностью примерно 10%. Тогда формула (3) принимает вид

$$p = 3.5 x (1 - \rho). \quad (8)$$

Подставляя (8) в (4), получим формулу для увеличения ширины запрещенной зоны, из которой исключено давление:

$$\delta E_g = 0.42 x (1 - \rho), \text{ eV}. \quad (9)$$

Обсудим величину параметра релаксации гетерограницы кластер-матрица ρ . В случае квантовой ямы гетерограница является плоской, а рассогласование постоянных решеток относительно невелико, поэтому естественно предположить, что релаксация отсутствует, т.е. $\rho = 0$. Рассмотрим тот пример, который изучался в нашей работе [4], а именно квантовую яму состава $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$ ($x = 0.2$). Очевидно, что в этом случае $\delta E_g = 0.08 \text{ eV}$. Мы вычисляем все энергии с точностью до 0.01 eV , поскольку более высокая точность не достижима из-за того, что нам доподлинно не известен параметр релаксации гетерограницы ρ . Увеличение ширины запрещенной зоны внутри квантовой точки из InAs окажется в пять раз больше и составит громадную величину 0.40 eV , которая превосходит исходную ширину запрещенной зоны, равную 0.35 eV . Отметим, что электронный уровень в такой квантовой точке не будет существовать, что противоречит опыту. Отсюда следует, что на границе кластера, представляющего собой квантовую точку, не возникает псевдоморфного (т.е. напряженного и бездислокационного) состояния. Возможно, это связано с условиями роста пирамиды квантовой точки InAs , которая располагается своим широким основанием на смачивающем слое InAs . По мере зарастивания смачивающего слоя арсенидом галлия происходит постепенное затопление пирамиды арсенидом галлия. Для этих условий довольно естественно предположить отсутствие возникновения растянутого кристалла GaAs , охватывающего пирамиду. Заметим, что строго доказать справедливость условия $f = 0$ на границе кластера мы не имеем возможности, по существу это лишь простейшее предположение. Поэтому предлагаемые здесь расчеты имеют, скорее, иллюстративный характер и численные результаты не претендуют на безусловную однозначность. Тем не менее предлагаемая теория весьма проста и расчеты могут быть с легкостью проделаны заново, если появятся экспериментальные данные, дающие основания для выбора параметра релаксации. Окончательный результат для ширины запрещенной зоны внутри кластера дается формулой (10) и каким-либо эмпирическим выражением для ширины запрещенной зоны безграничного твердого раствора E_G^X . Например, для $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ такая формула имеет вид [5]

$$E_G^{(x)} = 1.43 - 1.48x + 0.41x^2. \quad (10)$$

Тогда ширина запрещенной зоны внутри кластера будет

$$E_G = 1.43 - 1.06x - 0.42x\rho + 0.41x^2. \quad (11)$$

Сравним результат вычисления E_G в случае квантовой ямы по этой формуле ($E_G = 1.23$ eV) с тем значением, которое было принято в нашей работе [4], а именно $E_G = 1.21$ eV. Можно было бы пренебречь различием в 0.02 eV, однако если попытаться устранить его с помощью параметра ρ , то тогда следует положить $\rho = 0.25$, что также представляется разумным.

Дадим далее вывод формулы (3) для давления внутри кластеров простейших форм — сферической и плоской.

Упругие поля для сферической модели квантовой точки. Пусть кристаллические решетки квантовой структуры и окружающей матрицы характеризуются параметрами a_1 и a_2 соответственно. В рамках линейной теории упругие поля, возникающие из-за рассогласования $\Delta a = a_1 - a_2$, будут пропорциональны параметру несоответствия $f = \Delta a/a_1$.

Сферическая квантовая точка, имеющая радиус R_0 , может быть представлена упругим дилатационным включением. В этом случае полагают [7,8], что упругий шар радиусом R_0 вставлен в сферическую полость, объем которой меньше объема включения на ΔV . В силу симметрии поле перемещений как внутри шара $\mathbf{u}^{(1)}$, так и вне $\mathbf{u}^{(2)}$ имеет только радиальную компоненту, которая зависит только от радиальной координаты r [7]:

$$u_r^{(1)} = -\frac{2(1-2\nu)}{(1+\nu)} \frac{C}{R_0^3} r, \quad (12)$$

$$u_r^{(2)} = \frac{C}{r^2}, \quad (13)$$

где ν — коэффициент Пуассона. При этом упругие модули квантовой точки и окружающей матрицы считаются равными. Постоянная C определяется из граничного условия:

$$4\pi R_0^2 (u_r^{(2)} - u_r^{(1)}) \Big|_{r=R_0} = \Delta V \quad (14)$$

и оказывается равной:

$$C = \frac{1+\nu}{12\pi(1-\nu)} \Delta V, \text{ или иначе } C = \frac{1+\nu}{3(1-\nu)} R_0^3 f. \quad (15)$$

Во втором равенстве учтено, что изменение объема ΔV связано с параметром несоответствия f соотношением:

$$\Delta V = 4\pi R_0^3 f, \text{ или } \Delta V/V = 3f. \quad (16)$$

Поле перемещений (11) и (12) определяет следующие компоненты тензора деформаций (заданные в сферической системе координат):

$$\varepsilon_{rr}^{(1)} = \varepsilon_{\varphi\varphi}^{(1)} = \varepsilon_{\theta\theta}^{(1)} = -\frac{2(1-2\nu)}{3(1-\nu)} f, \quad (17)$$

$$\varepsilon_{rr}^{(2)} = -\frac{2(1+\nu)}{3(1-\nu)} \frac{R_0^3}{r^3} f, \quad \varepsilon_{\phi\phi} = \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{1+\nu}{3(1-\nu)} \frac{R_0^3}{r^3} f. \quad (18)$$

Очевидно, что дилатация

$$\delta = \sum_k \varepsilon_{kk}$$

внутри квантовой точки постоянна и равна:

$$\delta^{(1)} = -\frac{2(1-2\nu)}{1-\nu} f, \quad (19)$$

а вне точки вообще отсутствует:

$$\delta^{(2)} = 0. \quad (20)$$

Поле упругих напряжений находим из (17), (18) и закона Гука:

$$\sigma_{rr}^{(1)} = \sigma_{\varphi\varphi}^{(1)} = \sigma_{\theta\theta}^{(1)} = -\frac{2E}{3(1-\nu)} f, \quad (21)$$

$$\sigma_{rr}^{(2)} = -\frac{2E}{3(1-\nu)} f; \quad \sigma_{\varphi\varphi}^{(2)} = \sigma_{\theta\theta}^{(2)} = -\frac{1}{2} \sigma_{rr}^{(2)}, \quad (22)$$

где E — модуль Юнга. Соответственно давление

$$p = \frac{1}{3} \sum_k \sigma_{kk}$$

внутри точки описывается формулой (3), а вне точки равно нулю.

Упругие поля для плоской модели квантовой ямы. Выберем декартову систему координат так, чтобы ось y была перпендикулярна поверхностям, ограничивающим яму. Оси x и z параллельны этим поверхностям, а также кристаллографическим направлениям, вдоль которых

задано несоответствие f . Вне ямы упругие деформации и напряжения отсутствуют. Внутри ямы они задаются следующими соотношениями:

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{zz} = -f, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{2\nu}{1-\nu} f, \quad (23)$$

$$\sigma_{xx} = \sigma_{zz} = -\frac{E}{1-\nu} f, \quad \sigma_{yy} = 0. \quad (24)$$

Соответственно дилатация внутри ямы оказывается следующей:

$$\delta = -\frac{2(1-2\nu)}{1-\nu} f. \quad (25)$$

Итак, мы доказали, что давление внутри сжатой квантовой ямы или квантовой точки описывается одним и тем же выражением (3).

Список литературы

- [1] *Смит Р.* Полупроводники. М.: Мир, 1982.
- [2] *Benabbas T., Androussi Y., Lefebvre A.* // Journal of Appl. Phys. 1999. V. 86. N 4. P. 1945–1950.
- [3] *Andreev A.D., Downes J.R., Faux D.A., O'Reily E.P.* // Journal of Appl. Phys. 1999. V. 86. N 1. P. 287–305.
- [4] *Евтихийев В.П., Константинов О.В., Матвеевцев А.В.* // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. В. 6. С. 65–69.
- [5] *Landolt-Bornstein.* New Series III/22a.
- [6] *Эшелби Дж.* Континуальная теория дислокаций. М.: Иностран. лит., 1963.
- [7] *Теодосиу К.* Упругие модели дефектов в кристаллах. М.: Мир, 1985.